

# 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成25年 6月 5日現在

機関番号:13901 研究種目:挑戦的萌芽研究

研究期間:2012 ~ 2012

課題番号:24656519 研究課題名(和文)

電離を伴う非定常密度場計測のための単一結像2波長マッハツェンダー干渉計の開発研究課題名(英文) Development of single-plate, two-wavelength Mach Zehnder interferometer for the measurement of unsteady density field with ionization 研究代表者

佐宗 章弘 (SASOH AKIHIRO) 名古屋大学・工学研究科・教授

研究者番号: 40215752

研究成果の概要(和文): 2つの波長の光に対するマッハツェンダー干渉計画像を同一のカ ラーCCD 面上に結像し、非定常2次元(あるいは軸対称)の電離気体流れ場における重粒 子密度、電子密度分布を同時計測できるシステムを開発した。これは、屈折率変化に対す る密度・波長依存性が電子と重粒子で異なることを利用するもので、光源にはデバイス感 度が高い波長 473nm(B 成分)と 593nm(R 成分)の 2 台の CW 半導体レーザーを、ビ ームスプリッターを介して用いた。撮影は、カラーCCD 高速度カメラ(画素数;360× 410pixel、撮影条件; 200,000 コマ/秒、露光時間;  $3\mu$ s)を用いた。電離気体からの自 発光を除去するために、当該2波長帯域のみを透過するデュアルバンドパスフィルター(半 値幅 10nm)を用いることによって、S/N 比の飛躍的向上が実現した。得られた干渉計画 像に対して波長感度補正を行った後、それぞれ2次元フーリエ変換し、2次元周波数空間 にてノイズ除去を行ったのち、逆フーリエ変換、再構成を施すことによって位相変化の2 次元分布が得られる。このようにして得られた2つの2次元分布から適切な演算を施すこ とによって、重粒子、電子の密度分布が得られる。このシステムを、直径 350mm、長さ 400mm のテストチャンバー内で、TEA 炭酸ガスパルスレーザーを用いて生成したアルゴ ンプラズマの計測に適用し、重粒子密度 5×10<sup>25</sup>m<sup>-3</sup>、電離度約 10%のプラズマの軸対称密 度場測定に成功した。

研究成果の概要(英文): A new Mach-Zehnder interferometer, in which two interferograms with different wavelengths are imaged onto a single plate, has been developed. As light sources, semi-conductor lasers with the respective wavelengths of 473 nm and 593 nm are used. A dual-band-path filter is used to eliminate the effect of emission from ionized gas. The two-dimensional density distributions of heavy particles and electrons are obtained through digital data processing. Demonstration measurement was conducted with laser-pulse-generated plasma in a chamber of 350 mm in diameter and 400 mm in length, thereby obtaining a heavy particle density of  $5\times 10^{25} \text{m}^{-3}$  and a degree of ionization of 10 % in the axi-symmetric field.

## 交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
交付決定額	3, 100, 000	930, 000	4, 030, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:航空宇宙工学

キーワード:レーザー、マッハツェンダー干渉計、光学可視化、密度場計測、プラズマ

### 1. 研究開始当初の背景

航空宇宙工学で現れる高速流体では、高い 淀み点エンタルピーあるいは放電やレーザ ーによるエネルギー付加のために、電離領域 (以下、プラズマと呼ぶ)を伴うことが少な くない。このような流れでは、電離度が未知 であるため重粒子(中性粒子およびイオン) 密度とは独立に電子密度を計測する必要が ある。これに対する従来技術として、2つの 異なる波長を用いて干渉縞計測を行い、屈折 率の電子密度および重粒子密度に対する感 度の違いを利用して、干渉縞解析から両者の 分布を同時に求める2波長干渉計がある。し かし従来の方法では、ホログラフィーを用い ると単一現象しか記録できず、マッハツェン ダーを用いた場合の撮像デバイス (CCD) の 撮像面を 2 分割するため十分な空間解像が 得られないなどの問題があった。

#### 2. 研究の目的

本研究課題の目的は、2波長マッハツェンダー干渉計(屈折率の電子密度および重粒者の電子密度に対する感度の違いを利用して、両者の2次元空間分布を同時計測することが透過な干渉計)において当該2波長のみを透過であるがフィルターを通したのち干渉とでがある一般を単一のカラー撮像面に結像することがあるにないの共通のレファレンス空間分解能が格段に高められた2次に変ければ、電離を伴う非定常流れの電子・重粒子密度場を、高時空間解像度でれるで観光を強きなる。電子・電化診断計測することが可能になる。

## 3. 研究の方法

応募者の研究室には青山学院大学から譲 渡を受けたミラー直径 150mm のマッハツェン ダー干渉計があり、それをベースに不足部分 のパーツを補い、装置を完成させる。2次元 フーリエ変換を用いた有限縞解析プログラ ム (現状は、単一波長に対応) は大学院生長 谷川によって完成済みであり、これをさらに 2波長の干渉縞データから電子密度、重粒子 密度の2次元分布を求めるものに発展させ る。実証実験としては、まず①原理実証およ び定常現象への応用:デジタル(静止画)カ メラを用いたプラズマを伴う定常流れ (プラ ズマジェット) の電子・重粒子密度場計測に より原理実証を行う。次に、②非定常現象へ の応用:高速度カラーフレーミングカメラを 用いたレーザーパルス誘起プラズマの非定 常電子・重粒子密度場計測を行い、短時間非 定常現象への応用を実証する。

#### 4. 研究成果

装置の概略図を図1に示す。光源には・ =593 nm の橙色レーザー(SDL-593-030T、 Shanghai Dream Lasers Technology 社製)と =473 nm の青色レーザー(SDL-473-020T、 Shanghai Dream Lasers Technology 社製)を 用いた。光源の選定には、カメラ CCD の波長 に対する感度が重要であり、今回用いた 2波 長は波長 593 nm が R 値において、波長 473 nm が B 値において高い相対感度を有している。 これら2つのレーザーをハーフミラーを用い てパスを揃え、マッハツェンダ干渉計に入射 している。マッハツェンダ干渉計を通過後、 2 帯域のバンドパスフィルタを配置している。 透過帯域は波長 473 nm と 593 nm で半値幅 10 nm である。これは計測対象の自発光を除 去するためである。バンドパスフィルタ透過 後、ピンホールを配置することで、自発光と 余分な光を除去している。カメラは高速度カ メラを用いている。また、光源レーザーのコ リメートレンズ、撮像用のレンズには色収差 の少ないアクロマティックレンズを用いた。

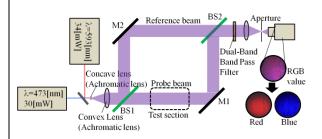
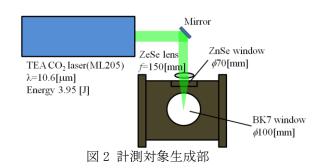


図1 開発した干渉計



2 波長単一結像マッハツェンダ干渉法を用いて行ったレーザー誘起プラズマの計測結果を示す。実験系を図 2 に示す。プラズマ生成のためのレーザーには  $TEA:CO_2$  パルスレーザー(ML-205、 SLCR 社製)を用いた。波長は  $10.6\mu m$ 、パルス幅は  $2\mu s$  である。出力直後のビーム形状は直径 40m の円形であり、1 パ

ルスあたりのエネルギは 3.95 J である。パルスエネルギの測定には、エネルギメータ (QE50LP-H-MB-D0、Gentec-E0 社製)を用いており、ミラーでの損失後の値である。レーザーの集光には f=150 mm の ZnSe レンズを用いて、小型の円筒形チャンバ( $\phi$ 350 mm x400 mm)内部に集光させている。チャンバ内部はアルゴンで満たされおり、圧力は 40 kPa に設定した。また干渉計用の可視化窓の材質は BK-7を用いている。撮影条件はフレームレート 200,000fps、 露光時間は 3.0  $\mu$ s である。

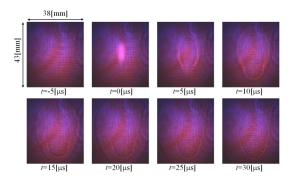


図3 干渉縞画像(波長による分離前)

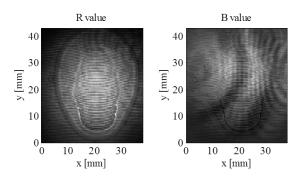


図 4 干渉縞画像 (波長による分離後)

高速度カメラにより得られた干渉縞画像を図3に示す。t=0µsにおいてブレイクダウン時の自発光が確認できる。ブレイクダウン時には、気体の急激な膨張によるブラスト波が発生している。t=5 µsから25 µsにかけてブラスト波の伝播の様子が確認できる。また、接触面はブラスト波に比べて遅い速度で一定の大きさまで伝播、低密度場として滞在していることがわかる。

図4に示すのは、この画像をR、B値に分割したものである。1波長ずつの測定結果からB値の画像には橙色レーザー(波長593nm)の縞が青色レーザー(波長473nm)の干渉縞と比較し3割程度の強度で含まれている事がわ

かった。これを除くために、R値の画像を 0.1 倍したものを B値から引くという補正処理を 行なっている。

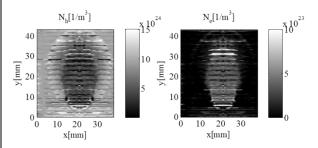


図 5 軸対称場における重粒子/電子密度分 布

図5に t=15 µs における重粒子密度分布と電子数密度分布を示す。今回の実験では、プラズマは軸対称と仮定し、アーベル変換により断面分布を求めている。密度上昇と接触面背後での密度が低くなっており、定性的に妥当な分布をしている。また電子数密度場を見ると、接触面背後で電子の存在が確認できる。

図 6 に y=22 mm における断面プロットを示す。x=6 mm 付近におけるブラスト波の背後で重粒子密度が大きく上昇していることがわかる。また x=12 mm 付近の接触面背後では、重粒子密度が減少しているとともに、電子数密度が増加しているのがわかる。重粒子密度は接触面背後で  $4x10^{24}$  m<sup>-3</sup>、電子数密度は  $0.3x10^{24}$  m<sup>-3</sup>程度を示している。図 7 には y=22 mm における断面での電離度を示す。接触面の内側では、0.07 から 0.08 程度の値を示している。局所熱平衡を仮定し、Saha の電離公式よりエネルギを求めると、約 1.4 eV と得られた。

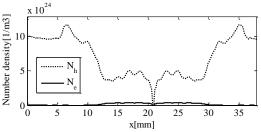


図 6 y=22mm における密度分布

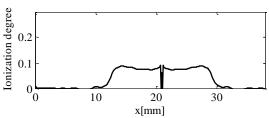


図7 y=22mm における電離度分布

以上のように、本研究課題では、単一画面に結像した2波長マッハツェンダー干渉計を開発し、レーザーパルスで生成したプラズマの密度計測に適用して、その機能を実証した。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計2件)

- ① 長谷川直紀,米元聖貴,横田茂,酒井武治,佐宗章弘, "カラーCCD を利用した単一結像マッハツェンダ干渉法による密度場計測," 第 44 回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム,富山国際会議場,富山,7月5日-6日,2012.
- ② 長谷川直紀,横田茂,佐宗章弘, "2 波長単一結像マッハツェンダ干渉法を用いた電離を伴う流れの計測,"第10回日本流体力学会中部支部講演会,ホテル杏泉閣,長野,11月9日-10日,2012.

〔図書〕(計0件)

[産業財産権]

- ○出願状況(計0件)
- ○取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等 なし

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

佐宗 章弘 (SASOH AKIHIRO) 名古屋大学・工学研究科・教授 研究者番号: 40215752

(2)研究分担者なし

(3)連携研究者なし